Abschlußbericht

Einsatz der Mikromechanik zur Herstellung frequenzanaloger Sensoren

Teilprojekt: Design, Herstellung und Charakterisierung von Sensoren mit thermischen Anregungsprinzip

Förderungskennzeichen: 13 AS 161A

Verbundpartner:

- (1) Fa. GMSmbH
- (2) HSG/ Institut f. Mikro- und Informationstechnik
- (3) BIZERBA Werke Balingen

Projektleiter:

- (1) Dipl.Phys. A.Schmid/ Dr.H. Bartuch
- (2) Dipl.Phys. H.-J. Wagner

Teilprojektbearbeiter: Dipl.Phys. T. Fabula

(3) Dr. K.P. Selig

Projektlaufzeit:

1.7.1989 - 31.12.1992

Arbeitsinhalte

Fa. GMSmbH

- Entwickung einer Labortechnologie zur Herstellung frequenzanaloger Sensoren auf Si-Basis mit den Schwerpunkten:
 - Untersuchungen an SiOxNy-Plasma-CVDSchichten
- Untersuchungen zur elektr. Stabilität eines löt- und bondbaren Kontaktschichtsystems
 - Anisotropes Si-Ätzen resonanter Balkenstrukturen
 - Layoutentwicklung und Bereitstellung von Maskensätzen
 - Musterbereitstellung

HSG/IMIT

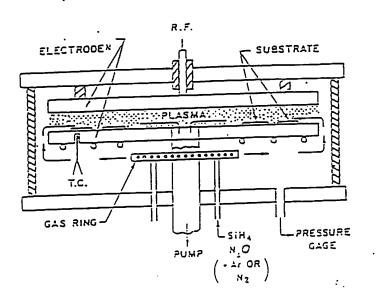
- Charakterisierung des Schwingungsverhaltens der Balkenstrukturen auf dafür entwickelten Meßplätzen bei passiver und aktiver Anregung
- Untersuchungen der sensitiven Eigenschaften der Resonanzfrequenz
- FEM-Berechnungen für Redesign und Wärmebilanz des Sensors

BIZERBA-Werke

- -Entwicklung einer elektronischen An regungsschaltung
- schwingungstechn.
 Charakterisierung aktiv angeregter Sensoren und exp. Bestimmung der Temperaturverteilung
- Untersuchungen zum Strömungseinfluß auf die Resonanzfrequenz

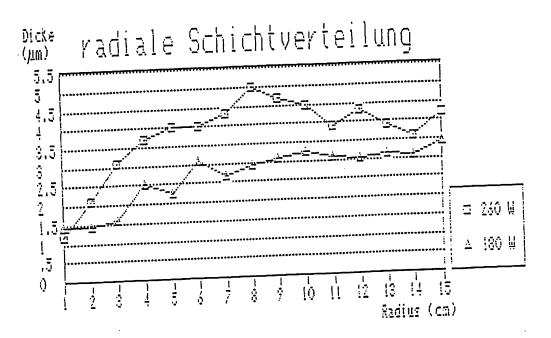
Topics

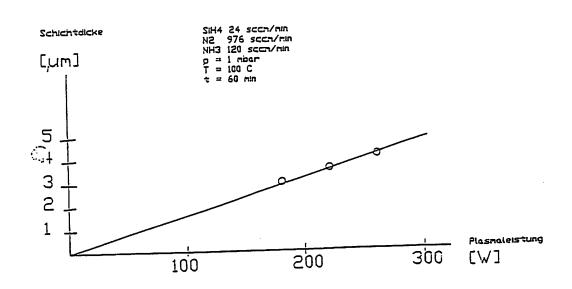
- Zusammenfasung der Untersuchungen an SiOxNy-Plasma
 CVD Schichten
- 2. Zusammenfassung der Untersuchungen zur elektr. Stabilität eines löt- und bondbaren Kontaktschichtsystems
- 3. Charakterisierung anisotrop geätzter resonanter Balkenstrukturen
- 4. Realisierung des thermischen Anregungsprinzips
- 5. Meßergebnisse zum sensitiven Verhalten der Strukturen
- 6. Schlußbemerkung

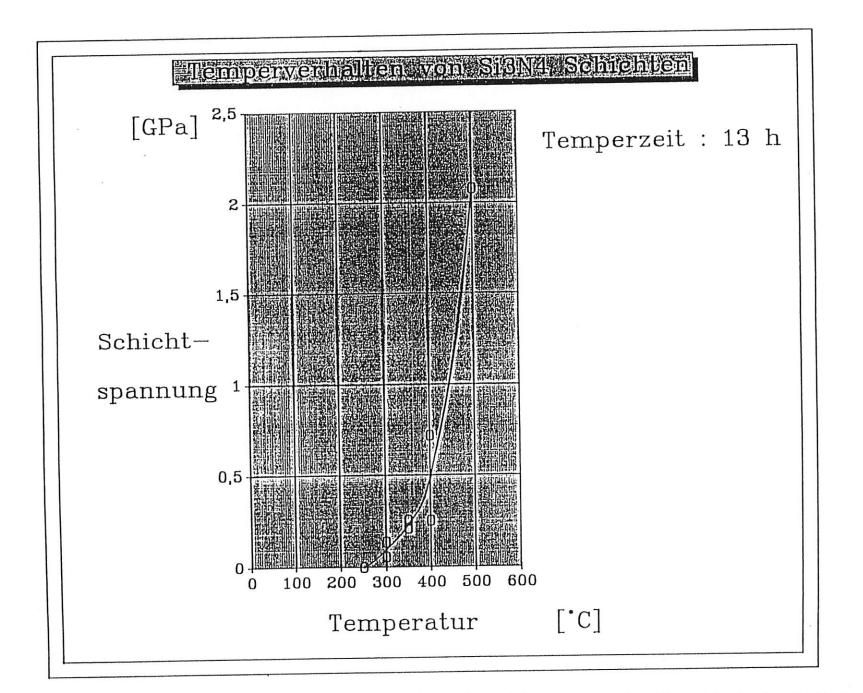


Parallelplattenreaktor

| 3555 mm |
|------------------------|
| 300 mm |
| 105 kHz |
| 100500 W |
| bis 350 ⁰ C |
| 0.5 1 mbar |
| |







Untersuchungen zur Eignung als Ätzmaskierung und zur Membranherstellung

| | | Ätzrate (KOH 30%/80° | Prozeßtemperatur | |
|----|------------|----------------------|------------------|-------------|
| | | vertikal | lateral | |
| S | i3N4 | 1 nm/min | | |
| S | iOxNy | 6 nm/min. | 24μ m/h | 100°C 200°C |
| S | i02 | 7.8 nm/min | | |
| tl | herm. Oxid | 7.2 nm/min | | |

- Eine zwar gute selektive Ätzbarkeit der Si3N4-Schichten gegenüber Si, aber zu starke laterale Unterätzungen und trotz abgesenkter Substrattemperatur zu hohe Schichtspannungen (Rißbildung) hatten zur Folge, daß dieser Weg nicht weiter beschritten wurde.
- Die technologischen Untersuchungen zum Aufbringen einer sensitiven Metallschicht (Ni) wurden gleichfalls eingestellt.
- Als Ätzmaskierung für die weitere Arbeiten wurde ausschließlich thermisches SiO2 in Betracht gezogen.

Untersuchungen zur Eignung als Passivierungs- bzw. Isolationsschicht

| | Si3N4 | SiO2 |
|-----------------------|---|--|
| Substrattemp. | 150°C | 300°C |
| Rate | 30 nm/min | 100 nm/min |
| Ätzrate (BHF 6:1) | | 160 nm/min |
| | therm.Oxid | 40 nm/min |
| Schichtdicke 12μm | hohe Pinholdichte; ungenügenderSchutz gegen a | aggressive Medien |
| | | Verbesserung der Stabilitätseigen- schaften von NiCr |
| Schichtdicke 58μm | | vereinzelt Pinhols |
| Durchbruchsfeldstärke | | $> 2*10^6 \text{ V/cm}$ |
| | | als Isolationsschicht gut geeignet |

- Passivierungseigenschaften lassen sich auf Grundlage der bisherigen Untersuchungen bei Bedarf gezielt verbessern.
- Erkenntnisse aus Untersuchungen der Isolationseigenschaften der SiO2-Schichten werden bereits technologisch genutzt.

Elektrisches Kontaktsystem

li forderungen:

olie 8

- lötbar, bondbar
- hohe thermische und mechanische Stabilität im Bereich von 120°C bis 180°C
 - ätzresistent gegenüber KOH

KONTAKTSYSTEMVARIANTEN

| barriere | Ni(400) | Au(160) |
|----------|--|-----------------------|
| 77 (50) | | Au(160) |
| | | Au(160) |
| | | Au(160) |
| - | - Ni(50) Ni(50)/Ti(60) Ti(50) | Ni(50)/Ti(60) Pd(448) |

Schichtdicke in nm

Technologie:

fichtabscheidung : Elektronenstrahl; in Vakuumfolge

≤ rukturierung : naßchemisch

Fontaktformierung: Variante 1 Variante 2

280°C, 2.5 h Luft 350°C, 24 h N2

Elektrische Untersuchungen — experimentelle Parameter

Teststruktur: Substrat

Dünnschichtkeramik

Vorderseite Heizschicht 200 Ohm, Kont.-sch.

Rückseite

Ni-Temp.-Meswiderstand

Anschlüsse

Cu—Draht, gelötet

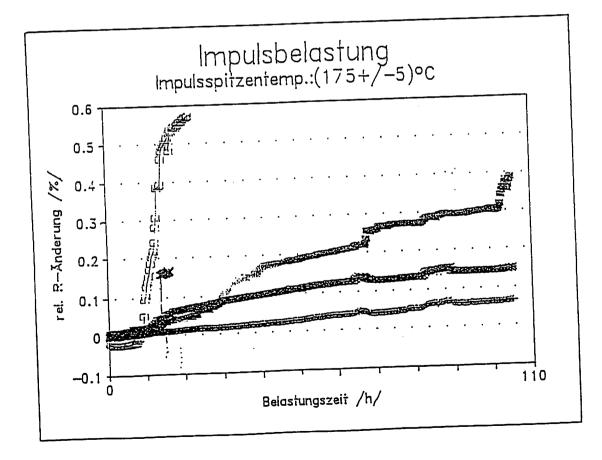
impulsparameter:

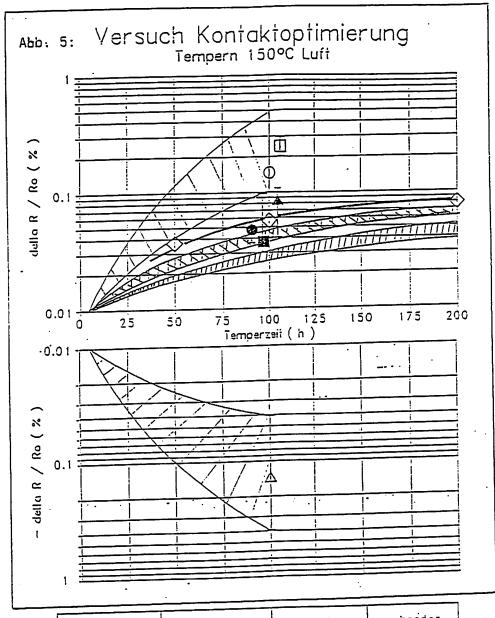
Imp.-Länge 1 sec; Frequenz 0.1 Hz

Leistung 0.98 W; Strom 70 mA

Impulsspitzentemperatur: $(175+/-5)^{\circ}C$

Ofeniemperung: (150+/-5)°C $(175 + / -5)^{\circ}C$





| Kontaktaufbau | Vorbehandlung | gelötet | gebondet |
|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Ni/Au | - 280°C | | |
| | 350°C | | 7//// |
| Ni/Pd/Au | 280.C | | XXXX |
| | 350°C | | 7//// |
| Ni/Ti/Pd/Au | 280°C | \triangle | · XXXX |
| | 350°C | A | 7///// |
| NiCr-Gru | ndkurve 280°C | . < | \rightarrow |

Elektrisches Kontaktsystem

Ergebnisse

- Eine signifikante Zunahme des Kontaktübergangswiderstandes bei Bondverbindungen und Temperaturen bis 200°C wurde variantenunabhängig nicht festgestellt.
- Lötverbindungen mit Standardkontaktsystem sind bei entsprechender thermischer Vorbehandlung (350°C, 24 h N2) bis ca. 160°C stabil möglich.
- Haftfestigkeit auf therm. SiO2 ist kritisch. Bewährt hat sich NiCr als zusätzliche Haftschicht.

Resonante Balkenstrukturen

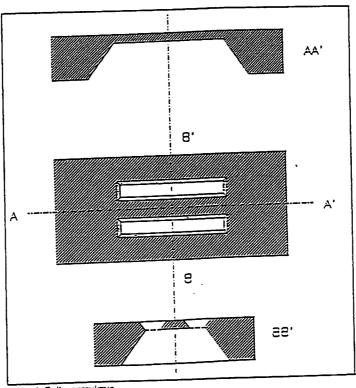


Abb. 1 Baikenstruktur

Die erste Resonanzfrequenz errechnet sich nach der Gleichung für einen, an beiden Seiten fest eingespannten, Balken

$$f_0 = 1,026 \frac{t}{l^2} \sqrt{\frac{E_{710}}{\rho}}$$
 (1)

mit

Baikendicke

 $t = 50 \mu m$

reduziertes E-Modul $E_{110} = 1.7 \cdot 10^{11} Pa$,

Dichte

 $\rho = 2.329 \, \text{g/cm}^3$.

| f,[Hz] |
|--------------|
| 4380 (1,00) |
| 6850 (1,00) |
| 12170 (1,00) |
| 27390 (1,00) |
| 48700 (1,00) |
| |

Technologie

Substrate: beidseitig polierte und oxidierte 3" Si - Wafer; Orientierung (100)

Laserjustierbohrung

Belacken der Vorder und Rückseite

Belichten, Entwickeln, Ätzen der SiO2-Maskierung für die V - Gruben

> Belacken der Vorder und Rückseite

Belichten, Entwickeln, Ätzen der SiO2 - Maskierung für die rückseitigen Fenster

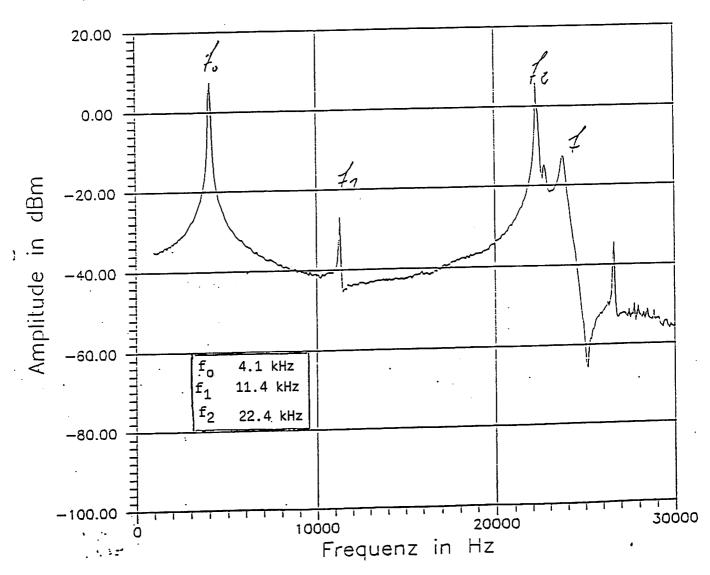
gleichzeitiges Ätzen von V - Gruben und Fenster in KOH (30 %, 60°, 16h)

Vereinzein

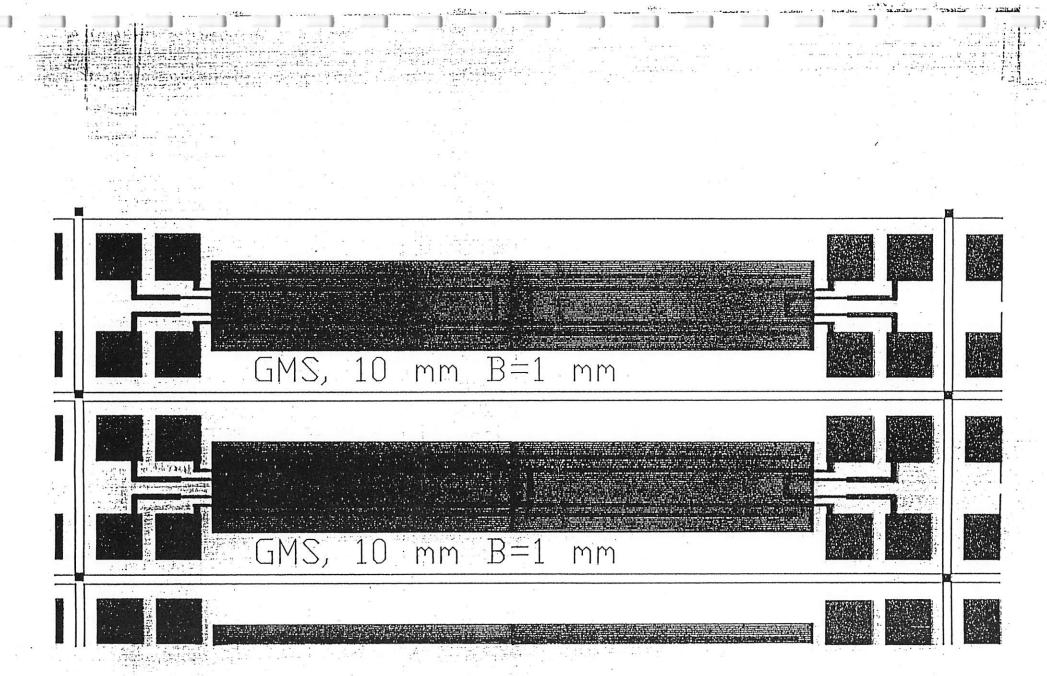
| geometr. Meßdaten | | | | | | |
|-------------------|--------------|------------|--------------|------------|-------------|------------|
| μm | | Breit | .e | | Dic | ke* |
| Wafer- Nr. | V-Gr Soll | ube Ist | Ball Soll | ken Ist | Bal Soll | ken Ist |
| 4 | 70 | 90 | 900 | 870 | 50 | 3035 |
| 5 | 70 | 83 | 900 | 887 | 50 | 4852 |
| 5 | 70 | 80 | 900 | 892 | 50 | 5650 |

[&]quot; durch HSI mit REM bestimmt

Frequenzspektrum eines 10mm-Schwingers



| | | Berechnun | g | | . Mess | ung | |
|-----|-----------------------|-----------|------------|---------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| 1 . | · f _i [Hz] | berechnet | Verhältnis | Balken . # | gemessen | Güte | Verhältnis |
| | f_0 | 4380 | 1,00 | 1 2 | 4150 - | 296 - | 1,00 - |
| 10 | fi | 12050 | 2,75 | 1 2 | 11390 - | 872 | 2,75 - |
| | f_2 | 23560 | 5,38 | 1 2 | 22410 - | 442 - | 5,40 - |
| | f ₀ | 6850 | 1,00 | 1 2 | 7180 7330 | ⁻ 377 488 | 1,00 1,00 |
| 8 | f_1 | 18840 | 2,75 | 1 2 | 19900 18990 | 836 950 | 2,77 2,59 |
| | f ₂ | 36850 | 5,38 | 1 2 | 36610 36260 | 610 1133 | 5,10 4,95 |
| | f_0 | 12170 | 1,00 | 1 2 | 14080 13740 | 140 138 | 1,00 1,00 |
| 6 | f _i | 33470 | 2,75 | 1 2 | 38320 37580 | 50 257 | 2,73 2,73 |
| · | f_2 | 65470 | 5,38 | 1 2 | - | - | - - |
| | f ₀ | 27390 | . 1,00 | 1 2 | 26860 26120 | 290 523 | 1,00 1,00 |
| 4 | f ₁ | 75320 | 2,75 | 1 2 | - | - | - |
| | . f ₂ | 147350 | 5,38 | 1 2 | - | - | - |
| | f_0 | 48700 | 1,00 | Eigenfrequenzen nicht eindeutig | | | indeutig |
| 3 | f_i | 133930 | 2,75 | | detek | tierbar | |
| | f_2 | 262000 | 5,38 | | | | |



13K - 10K -

elektrische Meßdaten :

- Brückenwiderstand

$$(445 + / - 5)$$
 Ohm

- Heizerwiderstand

$$(300 + / - 5)$$
 Ohm

- Temperaturkoeff.

$$(80 + / - 10) ppm/K$$

Technologischer Ablauf zur Musterbereitstellung

Substrate: beidseitig polierte und oxidierte 3" Si - Wafer; Photolithographie und Ätzen von Heizer, DMS und Padstruktur Orientierung (100) Ti(Pd) Au - Beschichten Laserjustierbohrung Photolithographie und Ätzen Belacken der Vorder des Padsystems und Rückseite Belichten, Entwickeln, Lackmaske für der SiO2-Maskierung für Bondpadverstärkung die V - Gruben Galvanische Goldverstärkung Belacken der Vorder der Pads und Rückseite gleichzeitiges Ätzen von Belichten, Entwickeln, Ätzen der SiO2 - Maskierung für V - Gruben und Fenster in KOH (30 %, 60°, 16h) die rückseitigen Fenster Vereinzeln (Wafersäge) NiCr - Beschichten

Thermisches Anregungsprinzip

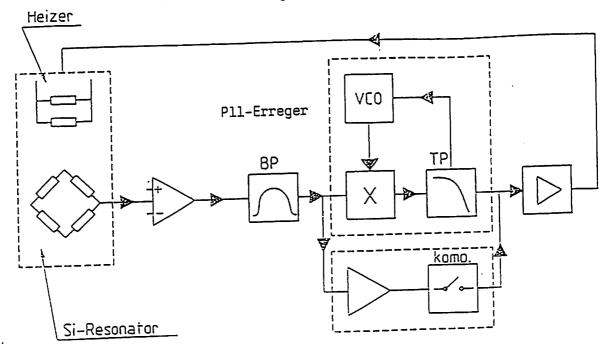
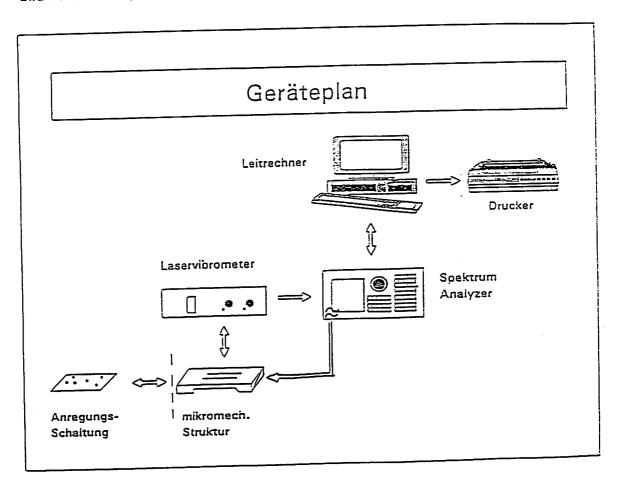


Bild 2: Prinzipschaltbild der verwendeten Erregerschaltung. (VCO: Voltage Controlled Oscillator; X: Mischer)

Bild 4.1: Geräteplan des optischen Meßplatzes

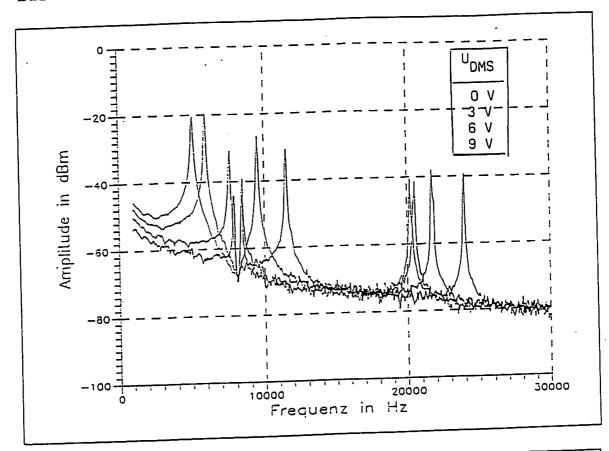


MESSERGEBNISSE

| (1. Layout) | Balke Länge /mm/ | n Dicke /μm/ | Frequenz theor. ge /kHz/ | m. | Güte |
|-------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|----|---|
| (Heiz | zleistung: 2 | * 60 mW) | • | | |
| 1 | 3 | 34 | 29 | 19 | 570 |
| = | 6 | 34 | 7 | 6 | 180 |
| <u> </u> | 8 | 34 | 4 | 4 | 220 |
| (Hei | zleistung: 2 | * 600 mW) | | | *************************************** |
| | 6 | 55 | 12 | 11 | 300 |
| | 10 | 55 | 4 | 4 | 300 |

| 1 | 10 mm - Balken | 1.Layout | | Redesign |
|---|--|----------|-----------|----------|
| | elektr. Leistung / mW / : | •••••• | | |
| | Heizer | 60 | 600 | 640 |
| - | Brücke | | 280 | 320 |
| | Temperaturdiff. / °C / | | 60 | 30 |
| _ | (Mitte / Rand) T _{max} | | 100 (170) | 68 |
| - | DMS - Signal / mV / (Verstfaktor: ca. 250) | - 1 | 40 | 200 |
| _ | Auslenkung / μm / | <0,1 | ca. 1 | ca. 1 |
| 1 | | | | |

Bild 8.14: Verschiebung der Amplitudenspektren verschiedener Temperaturzustände



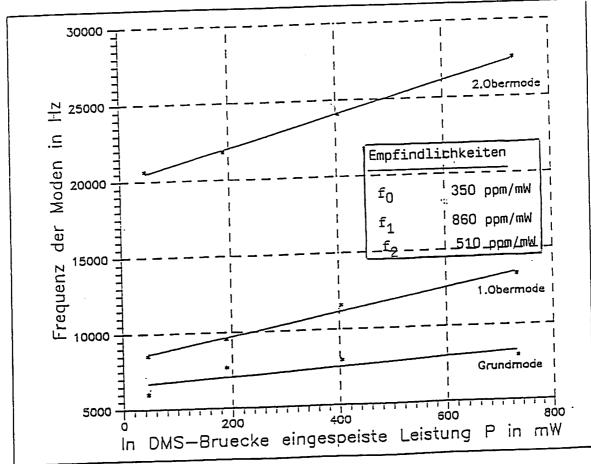


Bild 7.1: Seitenansicht der Vorrichtung zur Krafteinleitung

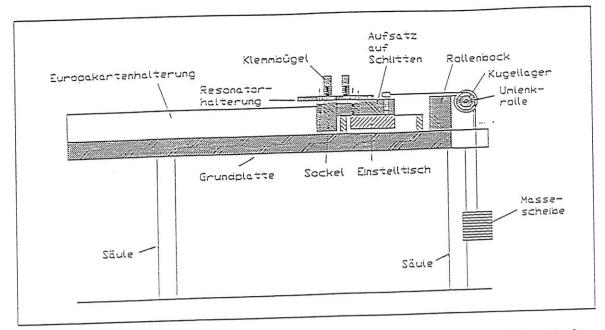
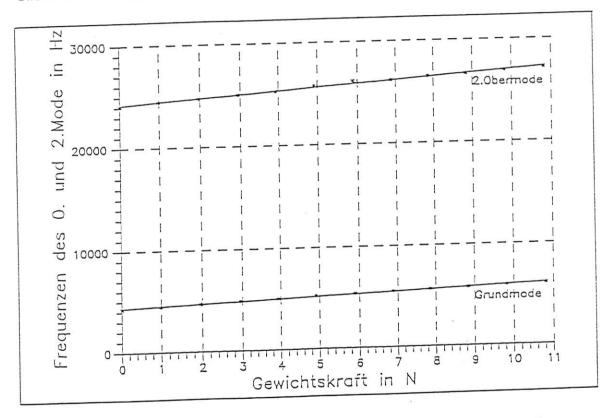


Bild 8.12: Abhängigkeit der Resonanzfrequenz von der eingeleiteten axialen Kraft



Aus den Kennlinien, die im gemessenen Bereich von $F_G=0$ - 11 N annähernd linear verlaufen, wurden die Kraftempfindlichkeiten der Moden ermittelt und in Tabelle 8.5 festgehalten.

Tab.8.5: Kraftempfindlichkeiten $\eta = \frac{1}{f_0} \cdot \frac{\Delta f}{\Delta F}$ der Moden im Bereich F = 0 - 11 N

| | Grundmode fo | 2.Obermode f ₂ |
|---|----------------------|---------------------------|
| η | 0,04 N ⁻¹ | 0,011 N ⁻¹ |

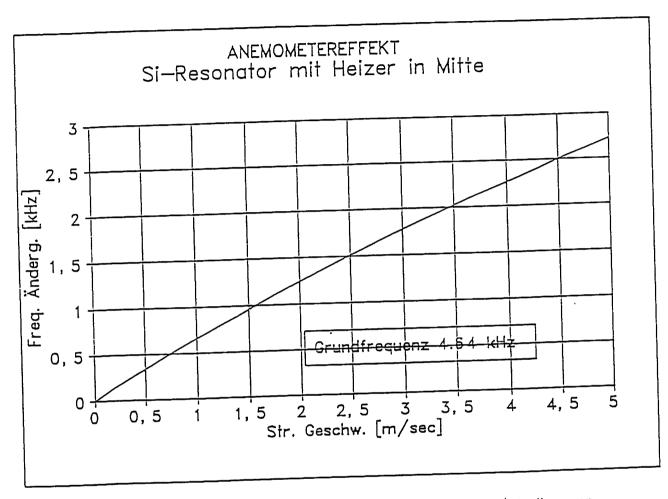


Bild 5: Abhängigkeit der Resonanzfrequenz von der Strömumgsgeschwindigkeit der Umgebungsluft.

SCHLUSSBETRACHTUNG

- Entsprechend der im Projektantrag für die Fa.Staiger/GMSmbH formulierten Aufgabenstellung wurden im Bearbeitungszeitraum alle wesentlichen Zielstellungen erreicht. Das betrifft insbesondere
 - Einrichtung einer Prozeßlinie zur Herstellung dreidimensionaler Mikrostrukturen auf Si-Basis
 - Herstellung mikromechanischer Resonatoren als Testmuster (elektrothermisch anregbar); Optimierung von Prozeßparametern
 - Untersuchungen zur Integration der Resonatoren mit elektronischer Signalverarbeitung (NiCr-DMS,Leitbahn- und Kontaktsystem;Passivierung); Optimierung von Prozeßparametern
 - Durch die Arbeiten der Verbundpartner im Teilprojekt konnte gezeigt werden, daß
 - das thermische Anregungsprinzip zur Herstellung frequenzanaloger Sensoren geeignet ist,
 - die nachgewiesenen Effekte für Sensoranwendungen (Kraft, Druck, Temperatur, Strömung) nutzbar gemacht werden können,
 - die Umsetzung in ein zuverlässig funktionierendes Sensorsystem jedoch noch beträchtlicher Anstrengungen bedarf (Reduzierung von Querempfindlichkeiten, insb. Temp.; Einleitung von Meßgrößen; Langzeituntersuchungen)